

신제품소개

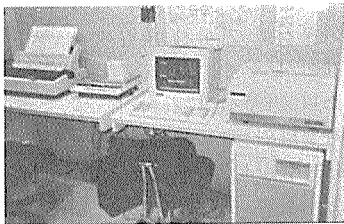
우편업무 자동화 시스템

□ (株)金星社

TEL : 701 - 1114

금성사는 우체국내에서 우편 종류에 따라 여러 창구에서 수작업으로 처리하던 업무를 단일 창구에서 접수하여 계량 및 우편요금에 자동적으로 계산되어 우표발행 및 우편 종류에 따른 일일 회계장부를 자동적으로 발행하는 우편업무 자동화 시스템을 국내 최초로 개발했다.

이 시스템은 주 전산 시스템인 메인 콘트롤러와 전자저울, 우표발행 전용 프린터 및 장부발행 범용 프린터로 구성되어 있다. 메인 콘트롤러는 데이터 관리 및 시스템 제어를 하고, 전자저울은 우편물 계량 및 우편요금 계산을 자동적으로 하며, 우표발행 프린터는 우표 및 영수증 발행과 발행된 우표의 데이터를 프린트하고, 장부발행 프린터는 각종의 회계장부를 인쇄한다.



Vacuum Handling System

□ 제조업체 : RECIF s. a. France

□ 연락처 : 웨스턴 테크닉 서비스 코리아 (534 - 4168/9)

1. 제품의 특징

- 가. Particle 오염 및 금속 오염 등을 극소화하기 위한 고성능 재질의 사용
- 나. 오염방지 및 수율 향상을 위한 제품 구조의 획기적 개선
- 다. 사용수명의 수배 연장으로 부가 가치 제공

2. 제품별 설명

가. Vacuum Handling System

- 1) PVDF 등의 재료 사용과 Wafer 접촉면적 최소화로 Wafer 오염 방지
- 2) Normal-open Quick-close형의 구

조적 개선으로 Wafer 파손율 극소화

- 3) 바닥형 및 벽형 Stand 사용으로 Line 안정성 및 편의성 향상

나. Mattalic Carrier

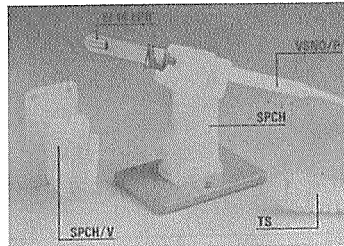
- 1) 우주항공용 알루미늄 합금을 모체로 사용
- 2) 표면강화를 위한 아노다이징 처리 (60 마이크로)로 Particle 오염 극소화
- 3) 250°C 까지의 반복적인 온도 Cycle 조건에서도 기계적 구조 및 차수의 불변

다. Flat Finder

- 1) PVDF 등의 재료사용으로 Wafer 오염방지
- 2) Top과 Bottom flat의 Alignment
- 3) 여러 종류의 Carrier에 대하여 호환성

라. Wafer Elevator

- 1) PVDF 등의 재료사용으로 Wafer 오염 방지
- 2) Wafer의 육안 검사 / 샘플링 또는 전수검사
- 3) Wafer 한개당 Slot한개 대응으로 수율 개선



* 각 제품마다 Wafer Size별로 제작 공급된다.

3. 응용 분야

- 가. Silicon, GaAs 등 Wafer 취급 Line
- 나. Crystal 및 Ceramics 등 공정중 오염이 우려되는 제조 Line
- 다. 기타 Particle 오염 및 금속오염을 극소화하기 위한 제조 Line

電流試驗시스템

□ Wayne Kerr Instruments Ltd,
Durban Road, Bognor Regis,

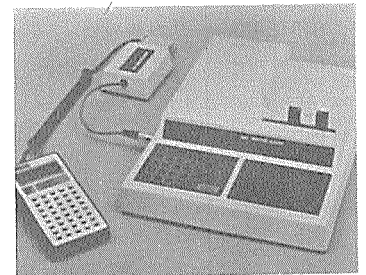
West Sussex, England PO22 9RL.

TEL : +44 243 825811,

Telex : 86420

□ 대리점 : 서울 영등포구 여의도동 24-3, 3J 테크놀로지社.

시간당 최고 1만개의 속도로 전자부품을 시험, 분류할 수 있는 값싼 자동식의 전자부품 시험시스템이 새로 개발돼 공급되고 있다. 이 4250 LCR 미터는 Wayne Kerr Instruments사에 의해 개발된 것으로, 최고 100KHz까지의 4종의 주파수를 이용하여 인덕턴스(自己유도계수), 정전용량(靜電容量), 저항과 다른 계측변수 중의 한가지를 동시에 측정할 수 있다.



이 장치는 휴대용의 순차 프로그래밍 장치와 접속될 수 있어, 장치에 내장된 불휘발성의 기억소자에 최고 15종의 완전한 시험순차 메뉴얼을 입력, 저장시킬 수 있다. 이들 순차 메뉴얼을 사용자가 임의로 2~3개의 키만 두드림으로써 호출시킬 수 있다. 특히 시스템은 서로 다른 시험단계의 순차 메뉴얼을 기억하여, 필요한 경우 특정 순차의 진행을 정지시킬 수 있으며, 적절히 「통과」 또는 「중단」의 메시지를 디스플레이로 나타내는 기능을 지니고 있다. 일단 순차 프로그래밍 장치를 분리시키면 사용자는 기억된 프로그램을 변경시키거나 일부를 수정하는 것이 불가능하다. 따라서 전자부품은 항상 한정된 양만큼씩 시험, 분류되며 이러한 분류 및 시험용량은 최고 시간당 1만개로 시험의 정도(精度)는 오차 0.5% 이내로 매우 뛰어나다.